

報道関係 各位

株式会社アドバンテスト

RF テスト・ソリューションを販売開始

多ポート RF デバイスの低コスト試験を T2000 テスト・システム上で実現

株式会社アドバンテスト（本社：東京都千代田区 社長：丸山利雄）は、携帯電話や各種無線通信周辺機器などに搭載され、RF 信号処理を行う多ポート SoC デバイスを高精度かつ低コストで試験可能な『RF テスト・ソリューション』を 11 月より販売を開始いたします。

開発の背景

近年、携帯電話だけでなくノート・パソコンやゲーム機などでも無線通信が利用されるようになってきております。さらに今後も、高精細な動画や画像のスムーズなやりとりをはじめ、より快適な無線通信環境を実現することが望まれています。このため、無線通信規格には、大容量データの高速伝送を可能にする WiMAX (802.16/e 規格)*や MIMO** など新しい通信規格の普及が見込まれており、アプリケーションのさらなる高機能化が期待されています。

また、アプリケーションの進化を支える SoC デバイスにおいても、今後、MIMO 方式などの通信規格に対応した IC や複数の通信規格に対応したトランシーバー IC が普及していくと見込まれています。これら最新の通信技術に対応したデバイスにおいては、RF 信号の入出力ポートがこれまで以上に多く必要とされています。しかしながら、従来のテスト・ソリューションでは十分なポート数による多数個同時測定が実現されておらず、低テスト・コスト化が困難となっておりました。

新製品の特長

このたび販売を開始する『RF テスト・ソリューション』は、新規開発した「T2000 12GHz ワイドバンド・シグナル・ジェネレータ/アナライザ・モジュール」により、RF 信号を扱う通信 SoC デバイスの高精度かつ低コストな試験を、OPENSTAR®規格に基づいた T2000 テスト・システム上で可能にするものです。

(1) 多ポート化を実現し、測定効率を大幅に向上

1 モジュールあたり 32 の RF 信号入出力ポート(システムでは最大 128 ポート)を搭載し、多ポート RF デバイスの多数個同時測定を可能にします。現在主流の 4~8 ポートの RF デバイスを 16 個同時に測定することができます。また、2008 年初め頃から普及が見込まれる 16 ポートのマルチバンド RF デバイスでも 4 個同時に測定可能です。

(2) 高い測定再現性を確保

新規開発した高速測定アルゴリズムにより高い再現性を実現しています。これにより高精度試験とテスト・タイムの短縮を可能にしました。

(3) RF SoC デバイスにおける全ての信号試験を1台のテストで実現

「T2000 12GHz ワイドバンド・シグナル・ジェネレータ/アナライザ・モジュール」を既に販売している800Mbps デジタル・モジュール、ベースバンド信号試験モジュール等と組み合わせることにより、RF SoC デバイスの全ての信号試験を、1台のテスト上で高精度かつ低テスト・コストで実現します。

今後も当社は、多様な試験ニーズに対応した高品質のテスト・ソリューションを T2000 テスト・システム上で提供し、お客様の製品の市場競争力強化に貢献してまいります。

* WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access) : 固定/移動無線通信の標準規格で、半径約 50km の範囲内で最大 70Mbps の通信を実現する新無線通信方式のこと。

* * MIMO (Multi Input Multi Output) : 送信回路と受信回路、対応アンテナをそれぞれ複数持つことにより多重化通信を実現し、安定した電波のやりとりと高速通信を実現できる方式のこと。

OPENSTAR®は Semiconductor Test Consortium, Inc の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

主な仕様

ベクトル信号発生部

周波数範囲：100MHz～6GHz
信号出力レベル：+8dBm～-120dBm
RFポート数：16 (4x4 MUX)
変調帯域幅：40MHz

ベクトル信号解析部

周波数範囲：100MHz～12GHz
信号入力レベル：+17dBm
RFポート数：16 (4x4 MUX)
平均雑音レベル：-153dBm/Hz

製品に関するお問い合わせ先

営業本部 ATE ソリューションビジネス部 電話:03-3214-7505

本ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な事象により予告無く変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。